

雙電性質譜系統

本院覽號

28A-950613

公告日期

智財權狀態

美國7,649,170已獲證、台灣(發明)I362051放棄維護、PCT已申請、中國放棄申請、歐盟放棄申請、日本放棄申請

摘要

本裝置可同時檢測由離子源所產生之任何電性的離子，且不會有任何時間延遲。此裝置可大量提高待測物的質譜資訊，並藉由圖譜比對獲得最正確的分子結構資訊。本裝置目前搭配MALDI法，未來將可推廣至其他離子源。

技術優勢

正、負離子同時偵測，沒有時間延遲 不需切換電壓極性，電路設計簡單 適用於MALDI離子源系統，也可擴展至其他離子源如SELDI，ESI，EI，CI等。儀器設計單純、維修容易。適用質量範圍高。

應用範圍

離子檢測、化學物質分析、生物質譜分析、物理化學分析

創作人

王亦生、陳仲瑄、蔡尚廷、陳邱文



中央研究院
ACADEMIA SINICA